

©1994 г.

## ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В ЛЕГИРОВАННОМ ТЕЛЛУРИДЕ ВИСМУТА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

*Т.Г.Абайдулина, М.К.Житинская, С.А.Немов, Ю.И.Равич*

Санкт-Петербургский государственный технический университет,  
195251, Санкт-Петербург, Россия

(Получена 4 марта 1994 г. Принята к печати 14 марта 1994 г.)

Изучено влияние отклонения от стехиометрии на электрофизические свойства поликристаллических образцов  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ , легированного одновременно 5 ат% In и 1 ат% Pb. Полученные образцы обладали дырочным типом проводимости. Обнаружено изменение характера зависимости концентрации дырок от избытков Te и Bi по сравнению с нелегированным  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ . Предложена интерпретация этих данных, основанная на предположении, что количество антиструктурных дефектов (атомов Bi в подрешетке Te) уменьшается в присутствии электроактивной примеси In. На концентрационной зависимости коэффициента термоЭДС  $S$  при температурах  $T \approx 120$  К обнаружен глубокий минимум вблизи  $p \approx 1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ , связанный, по-видимому, с межзонным рассеянием при участии примесных атомов In.

Теллурид висмута обычно кристаллизуется с отклонением от стехиометрического состава в сторону избытка висмута и с образованием антиструктурных дефектов — атомов висмута в узлах теллура  $\text{Bi}_{\text{Te}}$  [1], которые являются собственными дефектами акцепторного типа и создают концентрацию дырок около  $(5-6) \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ . Примесь индия в теллуриде висмута является слабым донором [2] с высоким пределом растворимости — до 25 ат% [3]. Электроактивное действие индия в  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  [2-4] объясняется следующим образом. Атомы индия занимают преимущественно места висмута. Поскольку висмут обладает большей электроотрицательностью, чем индий, атомы индия в узлах висмута имеют более высокий положительный заряд по сравнению с атомами висмута, что приводит к усилению поляризации связей при замещении висмута индием [4]. Вследствие поляризации связей уменьшается вероятность образования антиструктурных дефектов  $\text{Bi}_{\text{Te}}$  и, соответственно, понижается концентрация дырок при увеличении концентрации индия.

В настоящей работе изучалось влияние отклонения от стехиометрии на электрофизические свойства теллурида висмута, в который

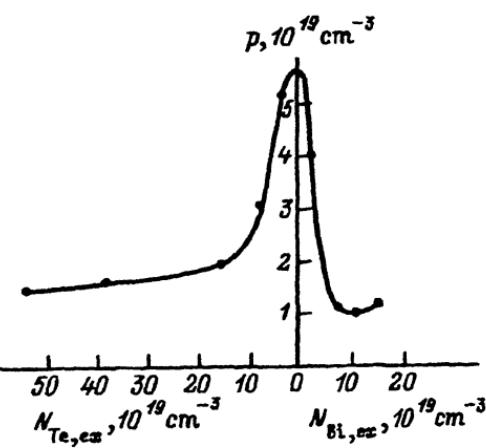


Рис. 1. Зависимость концентрации дырок ( $p$ ) от избытков висмута  $N_{\text{Bi},\text{ex}}$  и теллура  $N_{\text{Te},\text{ex}}$  в  $\text{Bi}_2\text{Te}_3:\text{In}:\text{Pb}$ . Концентрация дырок определена из величины коэффициента Холла при  $T = 77$  К, скорректированной с учетом хаотической разориентации кристаллитов в поликристаллах в соответствии с [5].

было введено 5 ат% In и 1 ат% Pb. Введенное количество примеси In находилось в пределах растворимости, но было заведомо больше числа собственных дефектов. Введение акцепторной примеси Pb обеспечивало проводимость  $p$ -типа во всех исследованных образцах, несмотря на большое количество донорной примеси.

Исследования были выполнены на поликристаллических образцах, полученных металлокерамическим методом при давлении прессования  $P = 5-6 \text{ т}/\text{см}^2$ , отжиг образцов производился при температуре  $380^\circ\text{C}$  в течение 100 ч. Однородность образцов контролировалась с помощью зондовых измерений термоэдс  $S$ , разброс в величине  $S$  не превышал 2-3%.

В интервале температур 77-420 К были измерены кинетические коэффициенты: электропроводность  $\sigma$ , термоэдс  $S$ , коэффициент Холла  $R$  и коэффициент поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена  $Q$ .

На рис. 1 изображена зависимость колловской концентрации дырок  $p = 1/eR_{77\text{K}}$  от избытка компонентов в шихте. Максимальная концентрация дырок, практически соответствующая количеству введенного свинца  $N_{\text{Pb}} = 6 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ , была получена в образцах квазистехиометрического состава  $(\text{Bi}_{0.95}\text{In}_{0.05})_2\text{Te}_3$ . При отклонении от стехиометрии в сторону избытка как Te, так и Bi происходит резкое уменьшение концентрации дырок, которое сменяется стабилизацией. Снижение концентрации при введении избытка Bi происходит быстрее, чем в образцах с избытком Te. Можно сказать, что избытки обоих компонентов теллурида висмута в исследованных легированных образцах обладают донорным действием, причем избыток Bi — более сильным, чем избыток Te.

Изломы на кривой, соответствующие переходу к стабилизации концентрации носителей тока, могут быть объяснены достижением предела растворимости компонентов. В наших образцах содержание теллура изменялось от 59.5 до 61.7 ат%, в то время как пределы области гомогенности определены с большим разбросом и составляют 59-62 ат% Te согласно [6] и 59.5-60.25 ат% Te по данным работы [7]. Концентрация дырок уменьшается при удалении в обе стороны от стехиометрии, когда состав образцов изменяется в интервале от 59.8 до 60.4 ат% Te. Таким образом, состав образцов на участках снижения концентрации соответствует области гомогенности.

Полученные зависимости холловской концентрации дырок от избытков Te и Bi контрастируют с соответствующими зависимостями для образцов теллурида висмута без индия, где избыток Bi обладает акцепторным действием, а избыток Te — донорным. Электроактивное действие избытков компонентов в нелегированном теллуриде висмута объясняется [8] антиструктурными дефектами при избыточном содержании обоих компонентов. Путем измерений плотности образцов авторы [8] пришли к выводу, что при отклонении от стехиометрии большого количества вакансий не образуется и, таким образом, в соответствии с формулой  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  из каждого пяти избыточных атомов висмута три занимают позиции теллура, т.е. на один избыточный атом висмута приходится в среднем  $3/5$  акцепторного антиструктурного дефекта  $\text{Bi}_{\text{Te}}$ . При избытке Te из пяти избыточных атомов теллура два находятся в узлах висмута, на один избыточный атом теллура приходится  $2/5$  донорного дефекта  $\text{Te}_{\text{Bi}}$ .

Коренное различие в электроактивном действии избыточного висмута в нелегированных и легированных индием образцах теллурида висмута мы объясняем упомянутым выше увеличением поляризации связи между атомами при замене висмута индием. Вследствие этого эффекта атомам индия энергетически выгодно занимать позиции в решетке, вокруг которых находятся атомы Te. При достаточно большом содержании индия это затрудняет переход избыточного висмута в узлы теллура, антиструктурные дефекты  $\text{Bi}_{\text{Te}}$  подавляются. Атомы Bi занимают только узлы собственной подрешетки, а в подрешетке Te образуются вакансы, причем на каждый избыточный атом Bi приходится  $3/2$  донорных вакансий.

При избыточном содержании теллура присутствие индия не мешает, а в какой-то мере способствует размещению избыточных атомов Te на местах Bi поблизости от атомов In. Поэтому антиструктурные

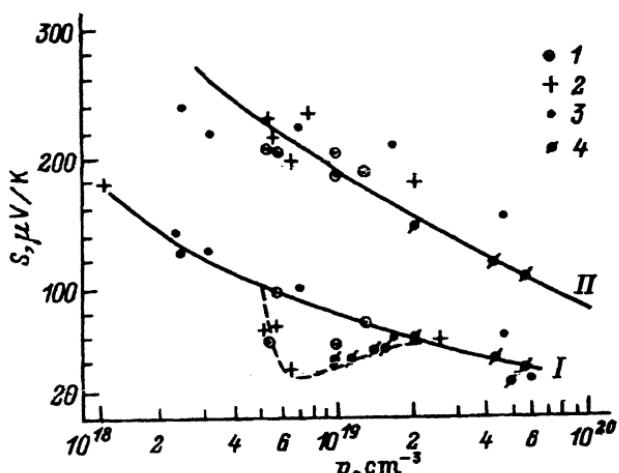


Рис. 2. Зависимость коэффициента термоэдс ( $S$ ) от концентрации дырок ( $p$ ) в образцах  $\text{Bi}_2\text{Te}_3:\text{In:Pb}$ .

$T, \text{ K}: I - 120, II - 300$ . 1 — данные [9], монокристаллы; 2 — [9], поликристаллы; 3 — [10]; 4 — наши данные. Сплошные линии — усредненные данные для  $p\text{-Bi}_2\text{Te}_3$  без In.

дефекты  $\text{Te}_{\text{Bi}}$  не подавляются, и на один избыточный атом  $\text{Te}$  имеется 2/5 донорного дефекта  $\text{Te}_{\text{Bi}}$ , как и в нелегированных образцах.

Таким образом, донорные дефекты в легированных индием образцах образуются при введении избытков как  $\text{Te}$ , так и  $\text{Bi}$ , причем различие в числе дефектов (3/2 дефекта на избыточный атом  $\text{Bi}$  и 2/5 дефекта на избыточный атом  $\text{Te}$ ) объясняет несимметричность кривой, изображенной на рис. 1: при отклонении от стехиометрии в сторону избыточного содержания висмута убывание концентрации дырок происходит заметно быстрее, чем при введении избытка теллура.

На рис. 2 представлены изотермы концентрационной зависимости коэффициента Зеебека  $S$ . Как и при легировании индием без отклонения от стехиометрии [9], имеется ярко выраженный минимум термоэдс при относительно низких температурах 120 К при концентрациях дырок вблизи  $p = 1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ . Появление этого минимума может быть объяснено [8] межзонным рассеянием с участием атомов индия.

Работа поддержана Конкурсным Центром фундаментального естествознания при Санкт-Петербургском государственном университете.

### Список литературы

- [1] Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  (1972).
- [2] J. Pancíř, J. Horák, Z. Starý. Phys. St. Sol. (a), **103**, 517 (1987).
- [3] A.J. Rosenberg, A.T. Strauss. J. Phys. Chem. Sol., **19**, 105 (1961).
- [4] J. Horák, P. Lošták, L. Beneš. Phil. Mag. B, **50**, 665 (1984).
- [5] D.J. Ryden. J. Phys. C, **4**, 1993 (1971).
- [6] J.P. Fleurial, L. Gailliard, R. Triboulet, H. Scherrer, S. Scherrer. Phys. Chem. Sol., **49**, 1237 (1988).
- [7] C.B. Satterwhite, R.W. Ure. Phys. Rev., **108**, 1164 (1957).
- [8] G.R. Miller, Chi-Yu Li. J. Phys. Chem. Sol., **26**, 173 (1965).
- [9] М.К. Житинская, С.А. Немов, Ю.И. Равич, Т.Г. Абайдулина, В.В. Компанеец, Г.С. Бушмарина, И.А. Драбкин. ФТП, **27**, 1719 (1993).
- [10] М.К. Житинская, В.И. Кайданов, С.А. Немов. А.с. № 3628-76, деп. 23с (1976).

Редактор В.В. Чалдышев

## Investigation of Intrinsic Defects in Doped Bismuth Telluride by Electrophysical Methods

T.G.Abaidulina, M.K.Zhitinskaya, S.A.Nemov, and Yu.I.Ravich

State Technical University, 195251, St.Petersburg, Russia

The influence of deviation from stoichiometric composition on electrophysical properties of  $\text{Bi}_x\text{Te}_y$  polycrystalline samples doped with 5 at% In and 1 at% Pb simultaneously was studied. All the samples possessed the hole conductivity. The change of density dependence on  $\text{Te}$  and  $\text{Bi}$  excess in comparison with undoped  $\text{Bi}_x\text{Te}_y$  was observed. The interpretation of the data obtained was based on the assumption that the number of antistructural defects ( $\text{Bi}$  atom at the  $\text{Te}$  site) decreases in the presence of the indium impurity. A deep minimum on the Seebeck coefficient  $S$  versus hole concentration curve was observed near the hole concentration  $p = 1 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  at temperature  $T = 120$  K. The minimum may be explained by interband scattering with participation of impurity In atoms.